

功能强大

硬件: Xplore SDD电制冷探测器以及X1处理器

- 满足ISO 15632:2012 国际标准, 100,000cps下进行分辨率检测
- 最高计数率>1,000,000cps
- 探测器有效晶体面积选项:
 - 15mm²≤129eV@Mn Kα——满足所有常规应用
 - 30mm²≤129eV@Mn Kα——灵敏度更高、速度更快

元素面分布图: 快速查看样品中的元素及分布

- 利用SmartMap采集样品的虚拟元素图像, 可后续离线分析
- "Live"实时元素成像分析

谱图采集: 准确可靠的定量分析

- 无需专业背景, 因Xplore系统采用先进的Tru-Q™ 技术自动探测谱峰并标识

报告/导出: 灵活、快速且简单

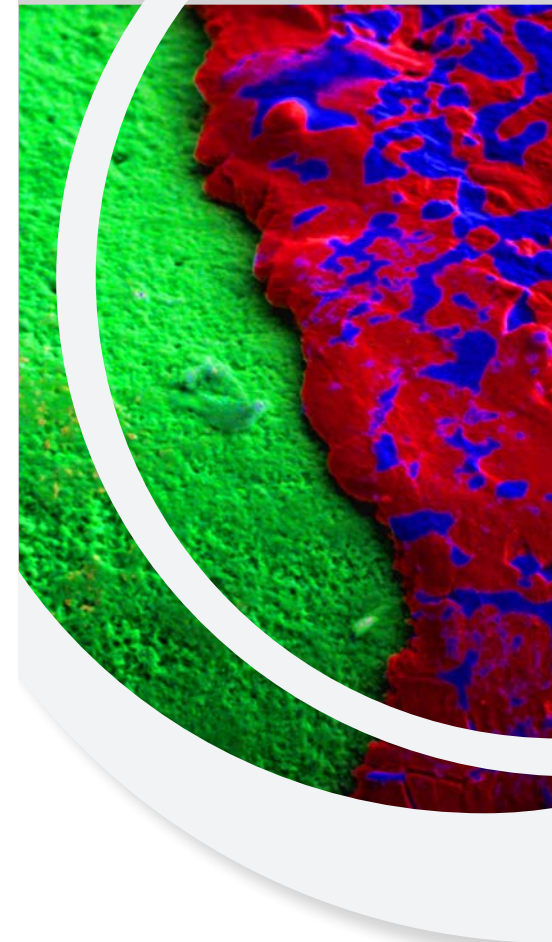
- 灵活的设置满足您报告的需求: 直接输出、添加注释或复制粘贴图像及谱图到报告中

线扫描: 沿线呈现元素、成分变化

- 显示元素成分在界面或特征处的变化

多语言设计: 11种语言间轻松切换

- 可以选择英语、法语、德语、俄语、简体中文、繁体中文、日语、韩语、西班牙语或者意大利语



iService®

牛津仪器售后服务团队为您提供:

1. 仪器安装
2. 维修
3. 定期的预防性维护
4. 软件升级
5. 液氮能谱升级
6. 能谱及EBSD产品的高级培训
7. 远程诊断

更多详细信息欢迎拨打热线:
400-678-0609

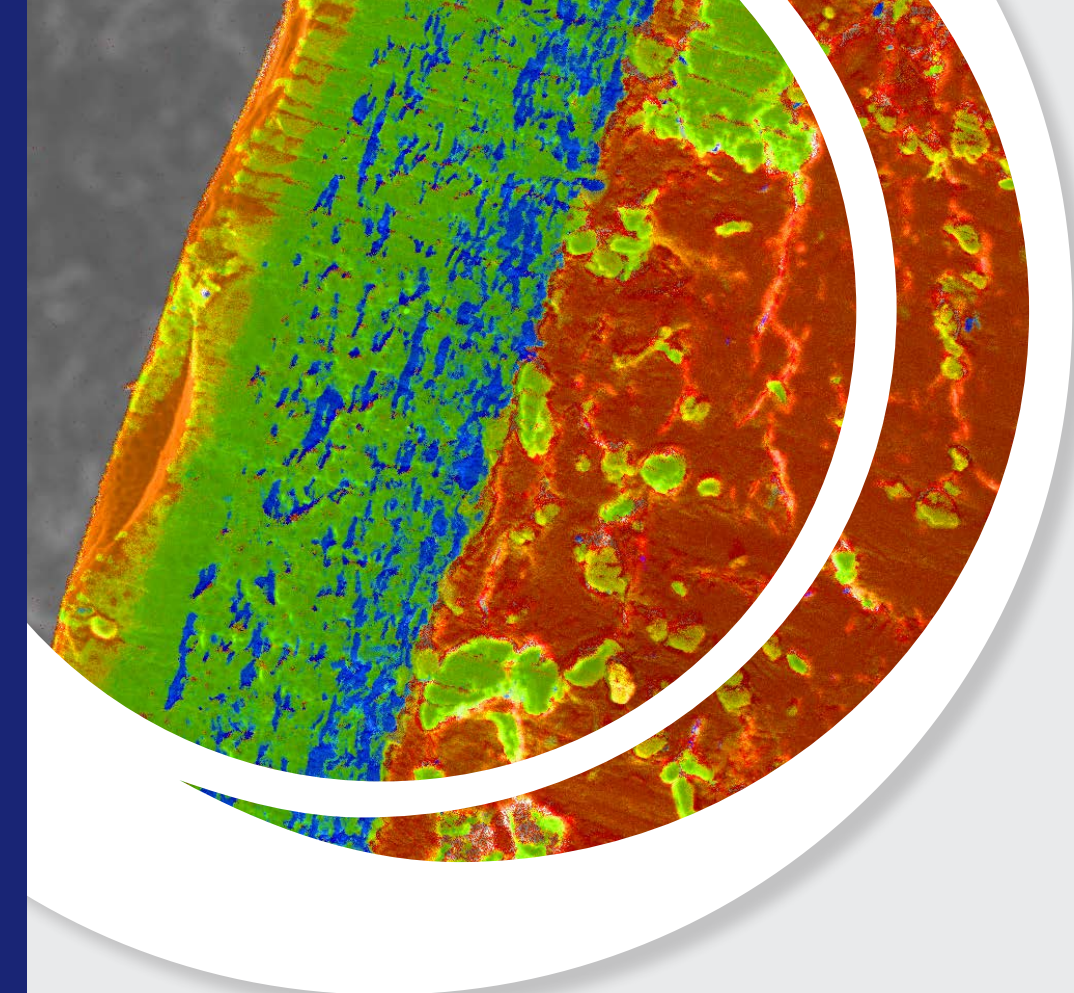
或发送邮件至:
China.nacs@oxinst.com

牛津仪器中文网站 www.oxinst.cn
EBSD教育网 www.ebsd.cn
电镜耗材在线商城 www.51haocai.cn

此彩页提供相关技术有限的介绍, 更多详情请访问或扫描下方二维码:
nano.oxinst.cn/Xplore

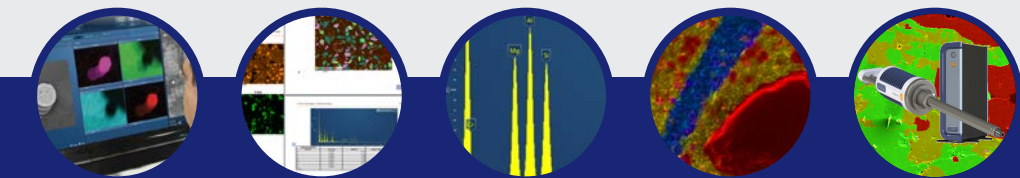


The materials presented here are summary in nature, subject to change, and intended for general information only. Additional details are available. Oxford Instruments NanoAnalysis is certified to ISO9001, ISO14001 and OHSAS 18001. Ultim and AZtec are Registered Trademarks of Oxford Instruments plc, all other trademarks acknowledged. © Oxford Instruments plc, 2018. All rights reserved. OINA/AZtecTEM/1118



专为扫描电镜配置的Xplore能谱仪

——Xplore15/Xplore30



OXFORD
INSTRUMENTS

OXFORD
INSTRUMENTS

简便易行

由实时AZtec能谱软件和Xplore SDD能谱硬件相结合，给您的SEM带来了系统的解决方案，具备独特的材料表征能力。

“Live”：实时元素成像 (RCI)

- 当您移动样品时，实时显示元素的变化；
- 让您的数据采集和分析，从长时间重复的过程转变得更动态、实时且更高效。

满足您需求的软件：灵活、易用且直观

- AZtecOne提供了极其简便易用的界面；
- AZtecLiveOne具备独特的能谱实时谱图监控功能；
- AZtecLiveLite具备独特的实时元素成像分析功能，灵活、强大、扩展性好。



软件及硬件配置比较

Description	AZtecOne	AZtecLiveOne	AZtecLiveLite
Xplore 15	√	√	√
Xplore 30	x	√	√
Analyzer定性定量分析	√	√	√
Point & ID选区分析	√	√	√
SmartMap全谱智能面扫描	√	√	√
Linescan全谱智能线扫描	√	√	√
Live Spectrum 实时能谱谱图	x	√	√
Live Mapping 实时元素成像分析	x	Option	√
Live Trace 轨迹跟踪	x	x	Option
Image Registration 图像导航	x	x	Option
Feature颗粒度自动分析软件	x	x	Option

快速高效

- 工作流程简便，易操作
- 采集及处理能力高，产出率高
- 从采集图像到输出报告，仅需几秒钟

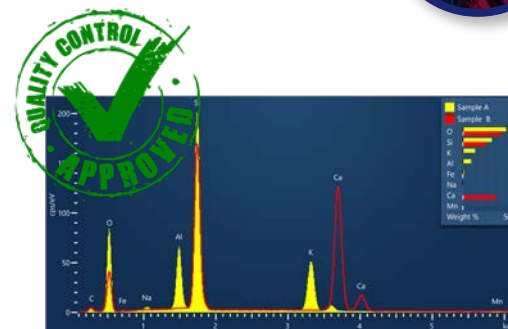
准确可依赖

- 无论什么样的操作条件，Xplore都将保证样品中每个元素：
 - > 自动识别并清晰标识
 - > 在采集过程中实时定量并显示
 - > 清晰、准确地显示元素分布

应用领域

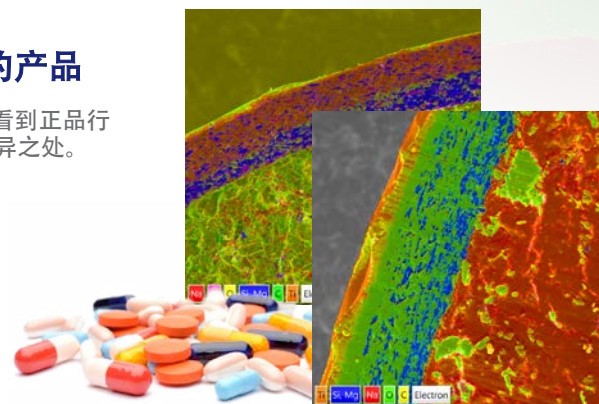
本系统广泛应用于：

- 增材制造
- 材料科学
- 地质、石油和采矿
- 汽车
- 化学工业
- 生物成像和生命科学
- 航空航天
- 能源生产和存储
- 高分子
- 半导体和微电子
- 食物和农业
- 刑侦和环境
- 医药
- 金属、合金、化合物及陶瓷
- 能源
- 化学和催化



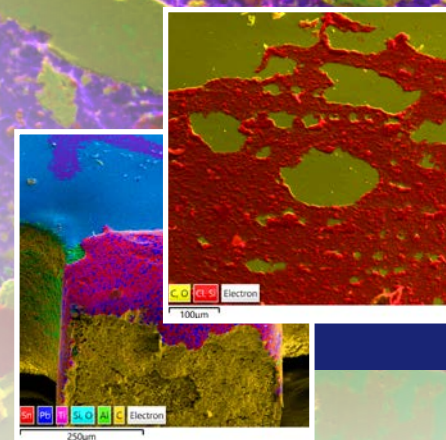
鉴定仿冒或侵犯专利的产品

- Xplore可以帮助您很容易地看到正品行货和仿冒品之间的相同或相异之处。



监测混合物

- 从混凝土到刹车片，Xplore常用于例行检测关键成分的分布，从而观察成分混合程度的好坏



失效分析

- Xplore可帮助所有行业来检测产品失效的原因，从半导体到高分子包装材料

用于质量控制的理想仪器

- 利用“实时”的谱图对比，迅速检出产品样品和“参考”样品之间的差别

薄膜和化合物

- 制备截面样品是研究薄膜结构的好方法
- 元素面分布图叠在电子图像上，可以清晰地区分不同层、镀膜和夹杂物的分布

